

华测认证

汽车电子元器件产品认证实施规则 分立器件

文件编号: CTI-PV12-05-2023

文件版本: A/02

修订日期: 2025-09-01

实施日期: 2025-09-01

批准人:

华测认证有限公司

CTI Certification Co., Ltd.



汽车电子元器件产品认证实施规则 分立器件

文件编号: CTI-PV12-05-2023

文件版本: A/02

实施日期: 2025-09-01

文件修订记录

| 序号 | | 文件状态 | | 创建日期 | 编制人 | 审核人 | 批准 |
|----|------|------------|---------------|------------|-----|--------|----|
| 0 | | 2023-05-18 | 张鑫 连爱 萍 | 古跃东 | 孙健 | | |
| 序号 | 修订章节 | 修订内容摘要 | 修订状态 | 修订日期 | 修订人 | 审核人 | 批准 |
| 1 | - | 修正部分描述 | A/01 | 2025-06-10 | 连爱萍 | 张鑫、古跃东 | 孙健 |
| 2 | - | 实施规则更名 | A/02 | 2025-09-01 | 连爱萍 | 古跃东 | 孙健 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



汽车电子元器件产品认证实施规则 分立器件

文件编号: CTI-PV12-05-2023

文件版本: A/02

实施日期: 2025-09-01

目录

| 1. | 适用范围 | 1 |
|----|------------------|----|
| 2. | 认证模式 | 1 |
| | 2.1 认证模式和依据标准 | 1 |
| | 2. 1. 1 认证模式 1 | |
| | 2.1.2 认证模式 2 | 1 |
| | 2. 2 认证依据标准 | |
| | 2.3 认证的基本环节 | 2 |
| 3. | 认证申请 | 2 |
| | 3.1 认证单元划分 | 2 |
| | 3. 2 申请认证提交资料 | |
| | 3. 2. 1 申请资料 | 3 |
| | 3. 2. 2 证明资料 | 3 |
| | 3.2.3 提供与产品有关的资料 | 4 |
| | 3. 3 受理 | |
| 4 | 鉴定试验 | |
| | 4.1 试验样品 | 4 |
| | 4.1.1 送样原则 | |
| | 4.1.2 样品数量 | |
| | 4.1.3 样品处置 | |
| | 4.2 试验要求 | 5 |
| | 4.2.1 试验依据标准 | |
| | 4.2.2 试验时限 | |
| | 4.2.3 试验报告 | |
| 5 | 初始工厂检查 | 10 |
| | 5.1 工厂检查内容 | |
| | 5.2 工厂检查时间 | |
| | 5.3 文件审核 | 11 |
| | 5.4 生产厂现场检查 | 11 |
| | 5.5 现场指定试验 | |
| | 5.6 初始工厂检查结论 | |
| 6 | 复核与认证决定 | |
| | 6.1 复核与认证决定 | |
| | 6.2 认证时限 | |
| | 6.3 认证终止 | |
| 7 | 获证后的监督 | |
| | 7.1 首次监督 | |
| | 7.2 后续的例行监督 | |
| | 7.2.1 检查频次及人日数 | |



汽车电子元器件产品认证实施规则 分立器件

文件编号: CTI-PV12-05-2023

文件版本: A/02

实施日期: 2025-09-01

| 7.2.2 例行监督检查的内容 | 13 |
|----------------------|----|
| 7.2.3 监督检查结论 | 14 |
| 7.2.4 监督抽样 | 14 |
| 7.2 监督结果评价 | 14 |
| 8. 认证证书 | 15 |
| 8.1 认证证书的保持 | 15 |
| 8.1.1 证书的有效性 | 15 |
| 8.1.2 认证产品的变更 | 15 |
| 8.2 获证单元覆盖产品的扩展和范围缩小 | 15 |
| 8.2.1 认证单元扩展 | 15 |
| 8.2.1.1 扩展程序 | 15 |
| 8.2.1.2 样品要求 | 16 |
| 8.2.2 范围缩小 | 16 |
| 8.3 认证证书的暂停、恢复、注销和撤销 | 16 |
| 9 认证标志的使用 | 16 |
| 9.1 准许使用的标志样式 | 16 |
| 9.2 认证标志的加施 | 17 |
| 9.3 加施标志的位置 | 17 |
| 10 收费 | 17 |
| 附件 1: 工厂质量保证能力要求 | 18 |



汽车电子元器件产品认证实施规则 分立器件

文件编号: CTI-PV12-05-2023

文件版本: A/02

实施日期: 2025-09-01

1. 适用范围

本规则适用于汽车电子元器件(分立器件)的质量认证,主要包括二极管,三极管和 IGBT 等。

2. 认证模式

2.1 认证模式和依据标准

2.1.1 认证模式1

认证模式:鉴定试验+获证后监督,适用于符合以下 1)-2)条要求的生产企业:

- 1) 管理体系成熟,符合如下条件之一:
- a. 持有效的 IATF 16949 管理体系第三方认证证书,且 IATF 16949 管理体系连续运行 2 年或以上、期间未被认证机构开具严重不符合项(提供机构的审核报告);或
- b. 已按照 IATF 16949 标准要求运行管理体系 2 年或以上,有二方客户的合格审核报告,且期间未被开具严重不符合项(提供客户的审核报告)。
 - 2) 所申请认证的产品技术先进、工艺成熟、质量稳定,符合如下条件其中之一:
- a. 所申请认证的产品(或与其高度相似的产品)已量产 6 个批次或以上,未发生 严重不良或质量投诉(提供客户订单和客户验货/收货记录); 或
 - b. 认证产品或同类产品获得相应的专利(提供专利证书); 或
- c. 提供持续时间在 6 个月或以上的、合格的产品可靠性测试报告(提供测试报告)。

2.1.2 认证模式 2

认证模式:鉴定试验+初始工厂检查+获证后监督。适用于除2.1.1以外的所有



汽车电子元器件认证实施规则 分立器件

文件版本: A/01

△川/ △ 八

生效日期: 2025-06-10

文件编号: CTI-PV12-05-2023

生产企业。

2.2 认证依据标准

《基于失效机理的汽车应用分立器件应力测试认证(FAILURE MECHANISM BASED STRESS TEST QUALIFICATION FOR DISCRETE SEMICONDUCTORS IN AUTOMOTIVE APPLICATIONS)》AEC-Q101-Rev E

2.3 认证的基本环节

认证的基本环节包括:

- a) 认证申请
- b) 鉴定试验
- c)初始工厂检查(适用时)
- d) 复核与认证决定
- e) 获证后监督

3. 认证申请

3.1 认证单元划分

原则上按单元申请认证,单一型号的产品可以作为一个申请单元。若具有多个型号,根据产品可靠性失效机理和其他影响产品质量的因素。如在申请提出前已实施鉴定试验,应保证符合认证单元划分的要求。

表 1 认证单元划分要求

| 序号 | 产品类 别 | 产品名称 | 认证单元划分 |
|----|-------|------|---|
| 1 | 二极管 | 二极管 | 原则上按型号申请认证。制程、设计、结构、 材料、气候类别均相同、额定电压相似的产品为一 个申请单元,同一单元中按最大、最小的相同数量 样品送样出具系列报告。 |



文件编号: CTI-PV12-05-2023

文件版本: A/01

生效日期: 2025-06-10

汽车电子元器件认证实施规则 分立器件

| | | | 同一制造商,生产场地(场所)不同时,应作 |
|---|------|------|---|
| | | | 为不同的认证单元。 |
| 2 | 三极管 | 三极管 | 原则上按型号申请认证。制程、设计、结构、 材料、气候类别均相同、额定电压相似的产品为一 个申请单元,同一单元中按最大、最小的相同数量 样品送样出具系列报告。 同一制造商,生产场地(场所)不同时,应作 为不同的认证单元 |
| 3 | IGBT | IGBT | 原则上按型号申请认证。制程、设计、结构、 材料、气候类别均相同、额定电压相似的产品为一 个申请单元,同一单元中按最大、最小的相同数量 样品送样出具系列报告。 同一制造商,生产场地(场所)不同时,应作 为不同的认证单元 |

3.2 申请认证提交资料

3.2.1 申请资料

- a)产品认证申请书;
- b) 工厂自查/调查表(首次申请时提交);
- c) 有效的 IATF 16949 汽车质量管理体系认证证书;
- d) 工厂质量管理体系文件清单.

3.2.2 证明资料

- a) 申请人、制造商、工厂的营业执照,适用时提交其他资质证明文件;
- b)申请人为销售者、进口商时,还须提交销售者和制造商、进口商和制造商订立的相关合同副本。
 - c)委托方、制造商与生产企业的 ODM/OEM 协议(适用时)。



文件版本: A/01

生效日期: 2025-06-10

文件编号: CTI-PV12-05-2023

汽车电子元器件认证实施规则 分立器件

3.2.3 提供与产品有关的资料

a) 元器件详细规范(含产品规格书、产品结构图、原材料清单、生产工艺流程 图及制程参数、产品一致性试验计划等);

- b) 同一申请单元内各个型号产品之间的差异说明;
- c) 生产设备清单;
- d) 检测设备清单;
- e) 其他需要的文件。

3.3 受理

CTI 收到申请文件后,依据相关评审要求对申请文件进行符合性审核,如申请文 件不符合要求, 应通知认证委托人补充完善。文件齐全后, 在 3 个工作日内发出受理 或不予受理通知。 受理时,认证机构与认证委托人签订认证协议。

4 鉴定试验

4.1 试验样品

4.1.1 送样原则

认证机构按照元器件详细规范选取样品,申请人负责把样品送至认证机构指定检 测机构进行鉴定试验。

4.1.2 样品数量

依据标准 AEC-Q101-Rev-E FAILURE MECHANISM BASED STRESS TEST QUALIFICATION FOR DISCRETE SEMICONDUCTORS IN AUTOMOTIVE APPLICATIONS 表 2 要 求。



文件版本: A/01

生效日期: 2025-06-10

文件编号: CTI-PV12-05-2023

汽车电子元器件认证实施规则 分立器件

4.1.3 样品处置

鉴定试验结束并出具鉴定试验报告后,有关试验记录由检测机构保存,样品按认 证机构有关要求处置。

4.2 试验要求

4.2.1 试验依据标准

试验依据标准 AEC-Q101-Rev-E FAILURE MECHANISM BASED STRESS TEST QUALIFICATION FOR DISCRETE SEMICONDUCTORS IN AUTOMOTIVE APPLICATIONS 以及经 认证机构批准的元器件详细规范。

具体试验项目、方法及要求参考表 2 所示:

表 2 鉴定试验项目、方法及要求

| | | | | | 表 | ₹ 2-1: <u>测试组 A</u> | \ -加速环境应力测试 |
|----------|-------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---|---|
| 应力 | 缩写 | <u>#</u> | 样本 量 <u>/</u> <u>批</u> 数 批 | | 验收 <u>标准</u> | 测试方法 | 附加要求 |
| 预处理 | PC | <u>A1</u> | A2、 A4、 C8的 | 式前 A3、 A5 和 I_SMD E零件 | 0 <u>失效</u> | JEDEC/IPC J- STD-020 JESD22-A- 113 | 仅在测试 <u>A2、A3、A4、A5 和 C8</u> 之前对表面安装零件(SMD)进行测试。PC 前后进行检测。必须报告任何零件的更换情况。 |
| 高度加速压力测试 | HAST | <u>A2</u> | 77 | 3 注 B | 0 <u>失效</u> | <u>JEDEC</u> JESD22 <u>-</u> A- 110 | 在 T_A =130° C/85%RH 下 96 小时,或在 T_A =110° C/85%RH 下 264 小时,以 80% 的额定电压进行零件反向偏压,直到超过 可能发生电弧的电压(通常为 42V)。 HAST 前后进行检测。 |
| 高高反压 | H³TRB | A2 alt | 77 | 3 注 B | 0 <u>失效</u> | <u>JEDEC</u> JESD22 <u>-</u> A- 101 | 在 T _A =85° C/85%RH 的条件下,在 80%的额定击穿电压下,零件反向偏压 1000 小时,最高可达 100V 或测试室的极限。至少在 H3TRB 前后进行测试 |
| 无 偏 | | | | 3注 | | <u>JEDEC</u> | 在 T _A =130° C/85%RH 下 96 小时,或 <u>在</u> |





汽车电子元器件认证实施规则 分立器件

文件编号: CTI-PV12-05-2023

文件版本: A/01

生效日期: 2025-06-10

| HAST | T UHAST A3 77 B 0 生効 | | 77 | В | o H 治 | JESD22 <u>-</u> A- | <u>TA=110° C/85%RH 下 264 小时</u> 。UHAST | |
|-------------|----------------------|--------------------------|----|----------|-------------|--|---|--|
| | UHAST | <u>A3</u> | 77 | | 0 <u>失效</u> | 118或 <u>A101</u> | 前后进行测试。 | |
| 高压釜 | AC | A3 alt | 77 | 3 注 B | 0 <u>失效</u> | <u>JEDEC</u> JESD22 <u>-</u> A- 102 | 96 小时,T _A =121℃,相对湿度 =100%, 15 磅/平方英寸。AC 前后进行测试。 | |
| 温度循环 | TC | <u>A4</u> | 77 | 3 注 B | 0 <u>失效</u> | <u>JEDEC</u> JESD22 <u>-</u> A- 104 附录 6 | 1000 次循环(T_A =最小范围为-55℃至最大额定结温,不超过 150 ℃)。可以使用超过零件最大额定结温 T_A (max)=25° C ,或使用 T_A (max)=175° C (如果最大额定结温高于 150 ° C) 将持续时间减少到 400 次循环。 TC 前后进行测试。 <u>关于 RDSon 的通过/失败限制,见 2.4 节。</u> | |
| 温度循环热测试 | ТСНТ | <u>A4a</u> | 77 | 3 注 B | 0 失效 | JEDEC JESD22-A- 104 附录 6 | 在热态时使用 PV 确定的极限值进行 TC 后的 125°C 测试,然后根据附录 6 对 5 台器件的所有导线进行开封和拉线测试 (测试 C3 WBP),适用于内部键合线尺寸为 5 mil 及以下的零件。(样本可能是测试 A4 的一个子集)。 | |
| TC 脱层 测试 | TCDT | <u>A4a</u> <u>alt</u> | 77 | 3 注 B | 0 失效 | JEDEC JESD22-A- 104 附录 6 J- STD-035 | 在 TC 后进行 100%的 AM 检查,然后按照附录 6 对 5 个脱层程度最高的零件的所有电线进行开封、检查或拉线测试 (测试 C3 WBS)。如果 AM 显示没有脱层,则不需要开封,需要检查和拉线测试。 | |
| 间歇工作寿命 | IOL | <u>A5</u> | 77 | 3 注 B | 0 失效 | <u>MIL-STD-750</u> 方法 1037 | 按表 2A 所示的持续时间进行测试。 TA=25°C。通电零件要保证△TJ≥100℃(不超过绝对最大额定值)。至少在 IOL前后进行测试关于 RDSon 的通过/失败限制,见 2.4 节。 | |
| 功 率 温度循环 | PTC | <u>A5</u> <u>alt</u> | 77 | 3 注 B | 0 失效 | JEDEC JESD22-A- 105 | 如果用 IOL 不能达到△TJ≥100℃,则进行 PTC。按照表 2A 中的时间要求的持续时间进行测试。通电零件和循环的测试室要保证△TJ≥100℃(不超过最大绝对额定值)。至少在 PTC 前后进行测试关于RDSon 的通过/失败限制,见 2.4 节。 | |

表 2-2: 测试组 B-加速寿命模拟测试



汽车电子元器件认证实施规则 分立器件

文件编号: CTI-PV12-05-2023

文件版本: A/01

生效日期: 2025-06-10

| 应力 | 缩写 | <u>#</u> | 样本 量 <u>/</u> 批 | <u>批</u> 数 | 验收 <u>标准</u> | 测试方法 | 附加要求 |
|---------|------|-------------|--------------------|------------|-----------------|---|--|
| 高温反向偏压 | HTRB | <u>B1</u> | 77 | 3 注 B | 0 <u>失效</u> | MIL-STD-750-1 M1038 <u>条件 A</u> <u>(用于二极管、</u> 整流器和齐纳 <u>管)</u> M1039 条件 A <u>(用于晶体管)</u> | 在规定的最大直流反向电压下 1000 小时,同时调整结温以避免热失控。允许将环境温度 T _A 从Ta(MAX)向下调整,以补偿电流泄漏和/或功率耗散。如果某项技术存在松豫效应,只有在冷却到30° C+/-5° C 时才应消除偏压。当不使用最大直流反转电压时,报告鉴定期间使用的直流反转电压。至少在 HTRB 前后进行测试(关于 HTRB,见注 X)。HTRB 之后,对双极和肖特基器件的 5个零件进行开封和拉线测试,这些器件只利用在芯片处有异种金属的键合系统(如金/铝)。键合应该比引线更牢固。 |
| 交流阻断电压 | ACBV | <u>B1</u> a | 77 | 3 注 B | 0 <u>失效</u> | MIL-STD-750-1 M1040 条件 A | 在用户/供应商规范中规定的最大交流阻断电压和结温下为 1000 小时。要调整环境温度 TA 以补偿电流泄漏。至少在 ACBV 前后进行测试 |
| 稳定状态下运行 | SSOP | <u>B1b</u> | 77 | 3 注 B | 0 <u>失效</u> | MIL-STD-750-1 M1038 条件 B (齐纳管) | 额定 IZ 最大 T _A 至额定 T _J 下 1000 小时, SSOP 前后至少测试一次。 |
| 高温栅极偏压 | HTGB | <u>B2</u> | 77 | 3 注 B | 0 <u>失效</u> | JEDEC JESD22- A-108 | 在指定的 Tj(max)额定值下 1000 小时,在详细规范中指出的最大栅极电压额定值的 100%下,栅极正极或负极偏压(取决于技术),零件偏压关闭。如适当,对一项新技术的初步鉴定进行三批负偏压和三批正偏压。通过将 T ₁ 提高 25°C,可以将持续时间减少到 500 小时,至少在 HTGB 前后进行测试。在使用异种金属(如金/铝)的键合系统的 MOSFET 上,在 HTGB 之后对 5 个零件进行开封和拉线测试。键合应该比引线更牢固。 |

| | 表 2-3: 测试组 C-封装组件完整性测试(续) | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|----------|-----|---|--------------------|------------|------------------|------|------|--|--|--|
| 应力 | 缩写 | <u>#</u> | 数据类 | 注 | 样本 量 <u>/</u> 批 | <u>批</u> 数 | 验收 <u>标</u> 進 | 测试方法 | 附加要求 | | | |

汽车电子元器件认证实施规则 分立器件

文件编号: CTI-PV12-05-2023

文件版本: A/01

文件版本: A/01 生效日期: 2025-06-10



气密性

HER <u>C15</u>

型 放大倍数 50 倍,参考表 2B 的 JEDEC J-焊接条件。通孔适用测试方法 可焊性 1注B 0 失效 SD C10 D, G 10 2 STD-002 A,SMD 适用测试方法B和D。 对于晶须的要求。以"零件族" 晶须生长 AEC-**WG** C11 为基础进行测试(镀层金属化、 3 评定 Q005 引线配置)。 D, MIL-STD- 仅 Y1 平面, 15kg 的力。CA 前 恒定加速 750-2 方 后进行检测。 G, 1注B 0 失效 **CA** C12 2 30 度 法 2006 Η, (1) 20Hz 到 100Hz 的范围内使用 D,_ **JEDEC** 0.06 英寸的恒定位移(双倍振 G, 振动变频 VVF C13 2 JESD2_B- 幅), 100Hz 到 2KHz 的范围内 Н, 使用 50g 恒定峰值加速度。 103 (2) VVF 前后进行检测。 第 <u>C12</u> 至 <u>C15</u> 项是对 JEDEC D, 1500g 持续 0.5 毫秒, 5 击, 3 气密封装的顺序测 JESD22-次定向。PTC 前后进行检测。 G, 机械冲击 MS C14 2 试。(见图例页的注 B-104 Η, H_o) (3)

| | 表 2-4: 测试组 D - 晶粒加工可靠性测试 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|---|---|-------------|-----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 应力 | 应力 缩写 # 样本 量/批 验收标 准 测试方法 附加要求 | | | | | | | | | | | | | |
| 电介质完整性 | DI | <u>D1</u> | 5 | 1 | 0 <u>失效</u> | AEC Q101-004 第 3 节 | 所有零件都必须超过最小栅极击穿电压(仅限功率 MOS 和 IGBT)。还需要比较加工前后的变化,以评估与测试 C5 的表 3 指南中的介电材料相关 | | | | | | | |

JEDEC JESD22-

A-109

D,

G,

H<u>,</u>
(4)

2

依照个别用户规范进行微量漏

泄测试和总漏泄测试。



文件版本: A/01

生效日期: 2025-06-10

文件编号: CTI-PV12-05-2023

汽车电子元器件认证实施规则 分立器件

工艺变更的稳健性。

| | | | | <u>表</u> | 2-5: 测 | 试组 E-电气验 | 社证测试 |
|-------------------------|-------------|-----------|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|---|
| 应力 | 缩写 | <u>#</u> | 样本 量/批 | <u>批</u> 数 | 验收 <u>标</u> 准 | 测试方法 | 附加要求 |
| 外部视觉 | EV | <u>E0</u> | | 递交测试用所 有鉴定零件 | | <u>JEDEC</u> JESD22-B101 | 检查零件结构、标记和工艺。 |
| 应力测试前 和应力测试 后相关要求 | 测试 | <u>E1</u> | 均依照 件规范 | 所有鉴定零件 均依照相应零 件规范相关要 求进行测试。 | | 用户规范或供 应商标准规范 | 依照适用应力参考中的规定在室温下进行测试。 |
| 参数验证 | PV | <u>E2</u> | 25 | 3 附注 A | - | 单独 AEC 用户 规范 | 根据用户规范在零件温度范围内测试所有参数,以确保符合规范。 |
| 静电放电表 | <u>ESDH</u> | <u>E3</u> | 30 HBM | 1 | - | AEC Q101-001 | ESD 前后进行测试。 |
| 静电放电表 | ESDC | <u>E4</u> | 30 CDM | 1 | - | AEC Q101-005 | <u>如适用</u> ,供应商必须记录无法容纳足够电荷来进行测试的 <u>小型封装</u> 。ESD 前后进行测试。 |
| 非钳制式感应开关 | UIS | <u>E5</u> | 5 | 1 | 0 <u>失效</u> | AEC Q101-004 第 2 节 | 还需要进行加工前后的变化比较,以评估与测试 E5 的表 3 指南中的工艺变更的稳健性。(仅限功 率 MOS 半导体和内部箝制 IGBT)。 |
| 短路表征 | SC | <u>E6</u> | 10 | 3 注 B | 0 <u>失效</u> | AEC Q101-006 | 仅适用于智能功率零件。 |

4.2.2 试验时限

样品试验时间一般为 90 个工作日,从收到样品及试验费用时算起。任何一项不 符合标准要求时,则判定该认证单元产品不符合认证要求。鉴定试验部分项目不合格

文件编号: CTI-PV12-05-2023

文件版本: A/01

生效日期: 2025-06-10

汽车电子元器件认证实施规则 分立器件

时,允许申请人进行整改并提供整改报告,整改应在认证机构规定的期限内完成,一 般不超过半年,未能按期完成整改的,试验结果判定为不合格,认证终止。

4.2.3 试验报告

由认证机构指定的有资质的检测机构对样品进行试验,并按规定格式出具试验报 告。认证批准后,检测机构负责给申请人发送一份试验报告。

5 初始工厂检查

5.1 工厂检查内容

- 5.1.1 初始工厂检查的基本原则是以认证的技术要求为核心,以研发设计一采购一生产 一检验试验—贮存交付为基本检查路线,重点关注关键工序和检验试验环节,现场确认 影响质量的关键要素。
- 5.1.2 首次申请认证的生产企业,工厂检查的内容为文件审核、工厂质量保证能力检查、 现场指定试验,应覆盖申请认证的所有加工场所。
- 5.1.3 已获证的生产企业申请新的认证单元,可不再进行文件审核,现场检查内容安排 如下:
- a. 如有相同类别的产品(见表 2)已获证,只安排现场指定试验。
- b. 如无相同类别的已获证产品,安排工厂质量保证能力检查和现场指定试验。

5.2 工厂检查时间

原则上初始工厂检查应在鉴定试验通过后一年内完成,否则应重新进行鉴定试验。 一般情况下,申请受理后、工厂质量保证能力检查前可进行文件审核,鉴定试验合格后, 进行工厂质量保证能力检查及现场指定试验。

工厂检查人日数应根据申请认证产品的单元数及工厂生产规模来确定,具体人日数 可参考表3拟定。



文件版本: A/01

生效日期: 2025-06-10

文件编号: CTI-PV12-05-2023

汽车电子元器件认证实施规则 分立器件

表 3 检查人日数

| 生产规模 | 100 人及以下 | 101-500 人 | 501 人以上 | | | |
|---------------|----------|-----------|---------|--|--|--|
| 初始检查(5.1.2) | 3-5 4-6 | | | | | |
| 初始检查(5.1.3.a) | 0. 5-2 | | | | | |
| 初始检查(5.1.3.b) | 2-3 | | | | | |
| 后续例行监督 | 2 | -3 | 3-4 | | | |

5.3 文件审核

文件审核内容为管理体系文件、鉴定试验报告、产品质量保证计划等文件的充分性、 符合性、有效性。

文件审核结束后,检查组应出具文件审核报告。认证机构应将文件审核阶段的问题 点通知企业,企业应按规定时间完成整改,一般情况下,应在现场检查前完成整改。

5.4 生产厂现场检查

现场检查包括工厂质量保证能力检查和产品一致性检查两部分。

- 5.4.1 工厂质量保证能力依据附件 1 工厂质量保证能力要求进行。
- 5.4.2 产品一致性检查包括以下内容:

检查员在生产线末端或者成品仓内抽取合格产品,检查以下内容是否与证书、认 证申请资料、型式试验报告、已确认的关键零部件清单等资料一致。

- 1) 认证产品的铭牌、说明书和包装上所标明的产品名称、规格型号、制造商/生 产厂等信息:
- 2) 认证产品的结构:
- 3) 认证产品所用的关键原辅材料、零部件。

5.5 现场指定试验

检查组应依据元器件规范、产品评估检测计划等文件,在指定的生产线上按规定



汽车电子元器件认证实施规则 分立器件

文件编号: CTI-PV12-05-2023

文件版本: A/01

生效日期: 2025-06-10

抽样组成检验批,由工厂负责现场检测,检测项目和检测结果应符合相关规范或要求,检测结果应予记录并经测试员、工厂负责人或其指定代表、检查员签字确认。

5.6 初始工厂检查结论

根据文件审核、工厂质量保证能力检查和现场指定试验结果,检查组出具工厂检查报告,并对工厂检查报告负责。工厂检查结论为不通过的,检查组直接向认证机构报告。工厂检查存在不符合项时,工厂应在规定期限内完成整改,认证机构采取适当方式对整改结果进行验证。未能按期完成整改的或整改不通过的,按工厂检查不通过处理。

6 复核与认证决定

6.1 复核与认证决定

认证机构委派符合要求的人员对认证档案进行复核,对产品鉴定试验结论、工厂 检查结论(适用时)进行综合评价。如有问题,应退回给相关人员整改。评价合格 后,做出准予发放证书的认证决定。

6.2 认证时限

一般情况下在认证决定后 5 个工作日内颁发认证证书,每个申请单元颁发一张证书。

6.3 认证终止

当产品鉴定试验不合格、工厂检查不通过或整改不通过,认证机构做出不合格决定 并终止认证。终止认证后如需继续申请认证,需重新申请认证。



文件编号: CTI-PV12-05-2023

文件版本: A/01

生效日期: 2025-06-10



汽车电子元器件认证实施规则 分立器件

7 获证后的监督

7.1 首次监督

选择认证模式1获证的企业,在首次获证后的6个月内安排首次监督检查,检查的要求同初始工厂检查。

7.2 后续的例行监督-

7.2.1 检查频次及人日数

- 一般情况下,例行监督每个日历年进行一次(且 2 次监督的相隔时间不超过 15 个月)。认证机构可根据产品生产的实际情况,调整例行监督检查的时机。若发生下述情况之一可增加监督频次:
 - a) 获证产品出现严重质量问题或用户提出严重投诉并经查实为持证人责任的:
 - b) 认证机构有理由对获证产品与认证依据标准的符合性提出质疑时:
- c) 有足够信息表明制造商、生产厂由于变更组织机构、生产条件、质量管理体系等而可能影响产品符合性或一致性时。

例行监督检查人日数根据获证产品的工厂生产规模来确定,一般情况下,具体人日数参考表3拟定。

7.2.2 例行监督检查的内容

例行监督检查的内容包括工厂质量保证能力检查、产品一致性检查和现场指定试验(按产品类别),每次其中工厂质量保证能力检查必查项目为附件1的3、4、5、7条款,其他条款可以抽样,2次监督内应覆盖所有条款。上次工厂检查不符合项的整改情况是每次监督检查的必查项目。同时应针对周期试验结果,评审周期试验频率的适宜度,并检查合格标志及合格证书的使用情况。



汽车电子元器件认证实施规则 分立器件

文件编号: CTI-PV12-05-2023

文件版本: A/01

生效日期: 2025-06-10

7.2.3 监督检查结论

检查组负责报告监督检查结论。监督检查结论为不通过的,检查组直接向认证机构报告。监督检查存在不符合项时,工厂应在规定期限内完成整改,认证机构采取适当方式对整改结果进行验证。未能按期完成整改的或整改不通过,按监督检查不通过处理。

7.2.4 监督抽样

认证机构抽样送指定实验室检测,抽样样品应抽取认证范围内有代表性的规格型号,所抽样品尽量避免与上一年度所抽样品重复。样品应在工厂生产的合格品中(包括生产线终端、仓库、市场等)随机抽取,产品鉴定试验中所规定的试验项目均可作为抽样检测项目。认证机构可针对不同产品的不同情况,以及其对产品安全性的影响程度进行部分或全部项目的检测。

抽样后,持证人应在 10 个工作日内将样品送到认证机构指定的检测机构,否则视为拒绝抽样,则暂停相关证书。检测机构在规定的时间内完成检测。如现场抽不到样品,则安排 20 日内重新抽样,如仍然抽不到样品,则暂停相关证书。如果抽样检验不合格,认证机构暂停不合格产品的相关证书。

认证模式1情况下的首次监督检查不抽样。

7.2 监督结果评价

认证机构组织对监督检查结论、监督抽样检测结果进行综合评价,评价合格的, 认证证书持续有效。当监督检查不通过或监督抽样试验不合格时,则判定年度监督不 合格,按照 8.3 规定处理相关认证证书。



文件编号: CTI-PV12-05-2023

文件版本: A/01

生效日期: 2025-06-10

汽车电子元器件认证实施规则 分立器件

8. 认证证书

8.1 认证证书的保持

8.1.1 证书的有效性

证书有效期为5年,证书的有效性通过定期监督维持。

8.1.2 认证产品的变更

8.1.2.1 变更的申请

证书内容发生变更或产品中影响产品质量的因素发生变更时,证书持有者应向认证机构提出变更申请。

8.1.2.2 变更评价和批准

认证机构根据变更的内容和申请人提供的资料进行评价,必要时送样进行检测或工厂检查,推荐检测项目参考 AEC-Q101-Rev-E 表 3: 测试选择的工艺变更指南,并保存相关记录。针对相关产品的变更,<mark>如有检测项目不适用</mark>,应给予合理解释或说明。检测合格或工厂检查合格后方可批准变更。证书内容发生变化的,换发证书,证书的编号不变。

8.2 获证单元覆盖产品的扩展和范围缩小

8.2.1 认证单元扩展

8.2.1.1 扩展程序

证书持有者需要增加与已获证产品为同一认证单元的认证时,应提交申请(新申请或变更申请)。认证机构核查扩展产品与获证产品的一致性,确认认证结果对扩展产品的有效性,针对扩展产品的差异进行补充检验,必要时安排工厂检查现场验证。评

| U | |
|---|--|

文件编号: CTI-PV12-05-2023

文件版本: A/01

生效日期: 2025-06-10

汽车电子元器件认证实施规则 分立器件

价合格后,据需要颁发新证书或换发证书。

8.2.1.2 样品要求

证书持有者应先提供扩展产品的有关技术资料,需要送样时,证书持有者应按第4.1章的要求选送样品供检测或检查。

8.2.2 范围缩小

持证人在证书有效期内需缩小认证范围时,应比照认证变更的要求办理证书变更 手续。

8.3 认证证书的暂停、恢复、注销和撤销

证书的使用应符合 CTI 有关证书的管理规定。当持证人违反认证有关规定或认证产品达不到认证要求时,CTI 按有关规定对认证证书做出相应暂停和撤销的处理,并将处理结果进行公告。

持证人可以向 CTI 申请暂停、注销其持有的证书。

证书暂停期间,持证人如果需要恢复证书,应在暂停期限内向 CTI 提出恢复申请, CTI 依据相关规定进行恢复处理,否则,CTI 将撤销被暂停的认证证书。

9 认证标志的使用

证书持有者使用产品认证标志必须遵守 CTI《产品认证证书和标志的管理程序》的规定。

9.1 准许使用的标志样式

获证产品允许使用如下认证标志:





华测认证有限公司 文件编号: CTI-PV12-05-2023

文件版本: A/01

生效日期: 2025-06-10

汽车电子元器件认证实施规则 分立器件

可等比例缩放,不允许使用变形标志、不允许加施文字说明。

9.2 认证标志的加施

可以采用统一印制的标准规格标志、模压式或印刷三种方式中的任何一种。

9.3 加施标志的位置

可在产品本体明显位置或标签、包装、说明书上加施认证标志。

10 收费

产品认证费用按照CTI的有关规定收取。



汽车电子元器件认证实施规则 分立器件

文件编号: CTI-PV12-05-2023

文件版本: A/01

生效日期: 2025-06-10

附件 1: 工厂质量保证能力要求

工厂是产品质量的责任主体,其质量保证能力应持续符合认证要求,并保证认证 产品与鉴定试验样品一致。工厂应接受并配合认证机构依据本要求及相关产品认证规 则所实施的各类工厂现场检查、抽样检测等活动。

1、通则

- 1.1 工厂应建立、实施、保持 IATF 16949 汽车质量管理体系和产品质量保证能力计划,以确保产品一致性及产品与标准的符合性。
- **1.2** 工厂应建立并保持与产品质量相关的文件化程序,确保文件和记录的充分性、有效性和适宜性,保存条件应满足客户要求并防止非预期的更改。
- 1.3 工厂应制定产品的质量目标及其实现的策划,并持续监视顾客满意。

2、设计

- 2.1 工厂应识别产品的主要性能指标,证实符合标准和客户的要求。
- 2.2 工厂应建立、实施和保持适当的设计过程,确保设计过程中实施了评审、验证、确认活动,并针对过程中发现的问题采取必要措施。
- 2.3 工厂应对产品设计期间及后续所做的更改进行适当的识别、评审和控制,确保这些更改对产品质量不会产生不利影响。

3、采购

- 3.1 工厂应制定并实施外部供方的选择、评价、分类管理、绩效监视以及再评价的程序,确保外部提供的过程、产品符合要求。
- 3.2 工厂应编制原材料采购清单并明确技术要求,对原材料确定必要的验证或其他活动,保存相关记录。
- 3.3 原材料的变更应及时通知认证机构及客户并得到批准。

4 、生产过程

4.1 工厂应识别关键工序并对其进行控制,操作人员应具备相应的能力,必要时应对适宜的过程参数进行监视、测量。量产前应制定产品质量的确认、批准、放行和追溯方案。



文件编号: CTI-PV12-05-2023

文件版本: A/01

生效日期: 2025-06-10

汽车电子元器件认证实施规则 分立器件

4.2 工厂应制定生产设备台账,对生产设备的验收、使用、保养、点检和维修进行控制。

- 4.3 工厂应对生产动力、环境、辅助材料和外协工序进行控制。
- **4.4** 工厂应规定生产过程变更控制要求,对因设计、工艺、原材料等引起的变更应进行评审和控制,变更前应及时通知认证机构及客户并得到批准。

5、质量一致性检验

- **5.1** 工厂应按照元器件详细规范和产品质量保证计划进行质量一致性检验,对检验不合格的产品批次应采取必要的措施。
- 5.2 工厂应对检验仪器进行计量、校准、维护,检验人员应具备相应的能力。

6、产品贮存与交货

- **6.1** 工厂应确保原材料、半成品、成品的贮存条件、标识和期限符合相关技术规范或客户要求。
- **6.2** 工厂应识别和控制不合格品以防止非预期交付,应规定适当的方案处理贮存超期产品。
- 6.3 工厂应确保包装、运输符合要求,必要时确保物流过程的可追溯性。

7、认证证书和标志

工厂对认证证书和标志的使用应符合认证机构的相关规定,明确不得加施认证标志的情况,并保存认证标志使用记录。